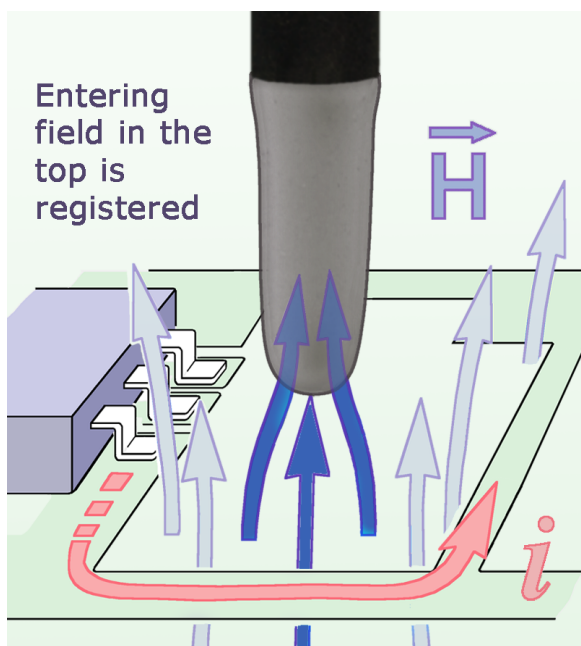


# XFS-B 3-1

Scannerprobe 30 MHz bis 6 GHz



## Kurzbeschreibung

Die Messspule der Magnetfeldscannerprobe XFS-B 3-1 ist orthogonal zum Sondenschaft angeordnet. Beim senkrechten Aufsetzen des Sondenkopfes liegt die Messspule direkt auf der Oberfläche der Flachbaugruppe. Dies ermöglicht den Einsatz an besonders schwer zugänglichen Stellen auf der Oberfläche von Leiterplatten, z. B. zwischen großen Bauteilen von Schaltreglern.

Die XFS-B 3-1 ist eine passive Nahfeldsonde. Sie erfasst Magnetfeldlinien, die orthogonal aus dem Messobjekt austreten. Magnetfeldlinien, die seitlich in die Sonde eintreten, werden nicht erfasst. Der Unterschied zur Magnetfeldscannerprobe XFS-R 3-1 besteht darin, dass die Spule um 90° gedreht angeordnet ist. Die Nahfeldsonde hat eine Mantelstromdämpfung und ist elektrisch geschirmt. Sie wird an einen Spektrumanalysator oder ein Oszilloskop mit 50  $\Omega$  Eingang angeschlossen. Die Magnetfeldscannerprobe besitzt intern einen Abschlusswiderstand.

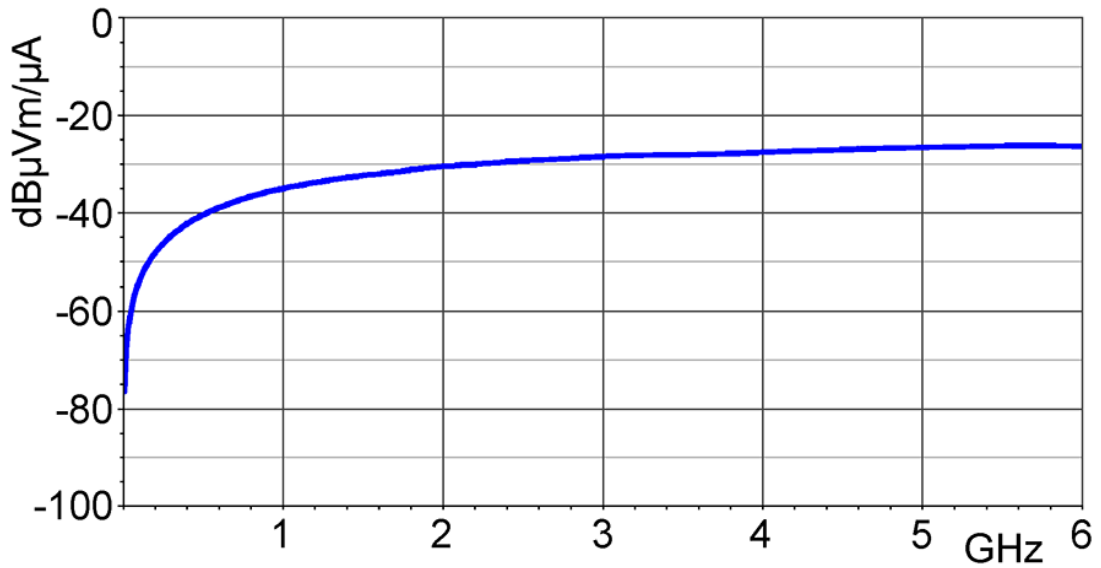
## Technische Parameter

Frequenzbereich	30 MHz ... 6 GHz
Auflösung	$\approx 2$ mm
Maße Sondenkopf	$\varnothing \approx 4$ mm
Anschluss - Ausgang	SMA, male, jack

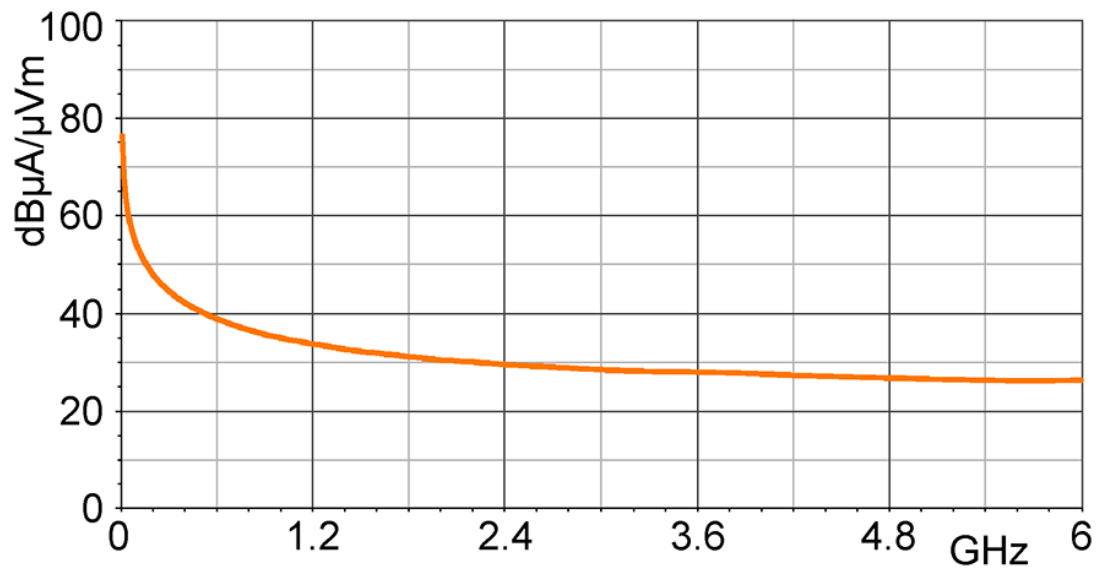
# XFS-B 3-1

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

Frequenzgang [dB $\mu$ V] / [dB $\mu$ A/m]



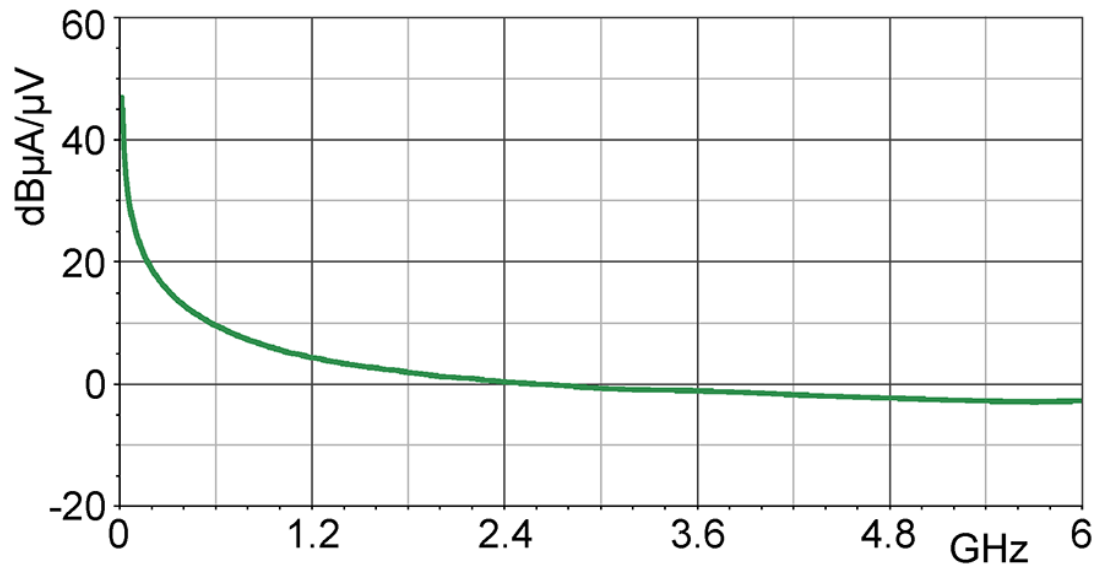
Korrekturkurve H-Feld [dB $\mu$ A/m] / [dB $\mu$ V]



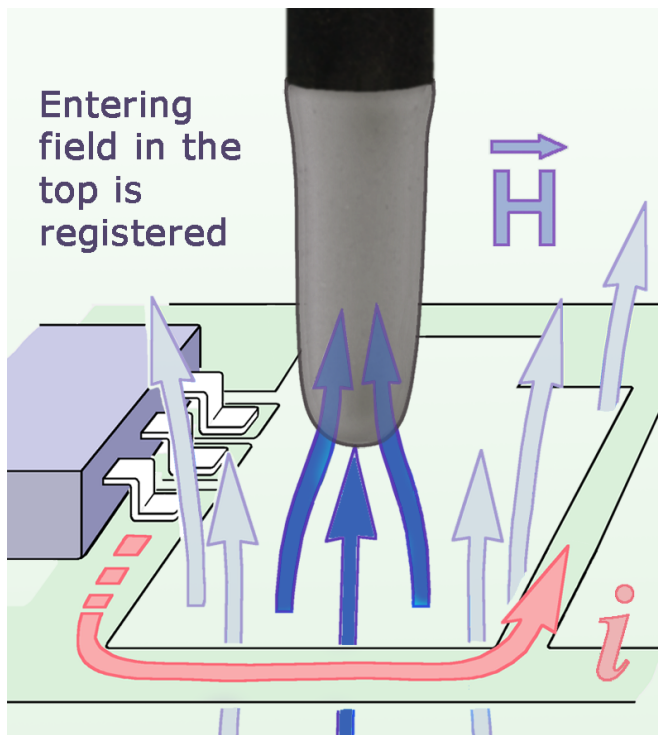
# XFS-B 3-1

Scannerprobe 30 MHz bis 6 GHz

Korrekturkurve Strom [ $\text{dB}\mu\text{A}$ ] / [ $\text{dB}\mu\text{V}$ ]



Messprinzip



# XFS-B 3-1

Scannersonde 30 MHz bis 6 GHz

**LANGER**  
EMV-Technik

